

УДК 537.533.3

О связях между коэффициентами сферической и хроматической аберраций электронно-оптических систем с двухмерными электростатическими полями / Л.Г.Гликман, Ю.В.Голоскоков // Научное приборостроение. — 1991. — Т. 1. — № 2. — С. 99-104.

В простом аналитическом виде найдены соотношения между коэффициентами сферической и хроматической аберраций электронно-оптических систем с электростатическими полями, описываемыми скалярным потенциалом, не зависящим от одной из декартовых координат. Предполагалось, что система имеет среднюю плоскость, являющуюся плоскостью симметрии поля. В частном случае, когда коэффициенты сферической аберрации равны нулю, отношения коэффициентов хроматической аберрации к дисперсии по энергии зависят только от угла входа пучка в электронно-оптическую систему. Библ. — 2 назв.

Л. Г. Гликман, Ю. В. Голоскоков
(Институт ядерной физики АН Казахской ССР,
Алма-Ата)

О СВЯЗЯХ МЕЖДУ КОЭФФИЦИЕНТАМИ СФЕРИЧЕСКОЙ И ХРОМАТИЧЕСКОЙ АБЕРРАЦИЙ ЭЛЕКТРОННО-ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ДВУХМЕРНЫМИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМИ ПОЛЯМИ

Информация о свойствах электронно-оптических систем всегда становится более полной, если удастся найти в простом аналитическом виде связи между характеризующими их параметрами. В данной работе такие связи между коэффициентами хроматической и сферической aberrаций находятся для систем со средней плоскостью, поле которых двумерно (электростатический потенциал φ не зависит от одной из декартовых координат). Декартова система координат x, y, z ориентируется так, что φ не зависит от координаты z . Движение заряженных частиц рассматривается в средней плоскости поля xz , являющейся его плоскостью симметрии.

Воспользовавшись постоянством импульса, соответствующего циклической координате z , решение уравнения, описывающего траекторию заряженной частицы, выходящей из источника с координатами $x = x_0$, $y = 0$, $z = z_0$ под углом α_0 к осевой траектории, можно записать в виде

$$z - z_0 = \sqrt{1 + \epsilon} \cos(\theta_0 + \alpha_0) \int_{x_0}^x (\operatorname{sgn} \dot{x})(F + C)^{-\frac{1}{2}} dx. \quad (1)$$

Здесь θ_0 — угол между осевой траекторией пучка и осью z в предметном пространстве; $F = F(x) = \varphi/\varphi_C$, где φ_C — потенциал предметного пространства; φ отсчитывается так, что энергия настройки электронно-оптической системы $W_C = -e\varphi_C$. Начальная энергия любой частицы из рассматриваемого пучка $W_0 = W_C(1 + \epsilon)$, где ϵ — относительный разброс по энергии частиц; $\operatorname{sgn} \dot{x}$ — знак составляющей скорости частицы по оси x . В подынтегральной функции от ϵ и α_0 зависит только параметр

$$C = \epsilon - (1 + \epsilon) \cos^2(\theta_0 + \alpha_0),$$

что будет использовано в дальнейшем при нахождении простых соотношений между aberrационными коэффициентами.

Равенство (1) для краткости запишем в виде

$$z - z_0 = \sqrt{1 + \epsilon} \cos(\theta_0 + \alpha_0) J(C, x). \quad (2)$$

Полученные ниже соотношения имеют место как для отклоняющей системы (x всюду больше нуля), так и для отражающей, когда

x меняет знак в точке поворота, где x достигает максимального значения $x = x_{\max}$. В последнем случае выражение для $J(C, x)$ необходимо преобразовать так, чтобы дифференцирование по параметру C не приводило к расходимости $J(C, x)$ в окрестности точки поворота, где подынтегральная функция обращается в нуль. При этом $J(C, x)$ записывается следующим образом:

$$J(C, x) = \int_{x_0}^{x_k} (F + C)^{-\frac{1}{2}} dx + 2 \int_{x_k}^{x_{\max}} (F + C)^{-\frac{1}{2}} dx - \int_{x_k}^x (F + C)^{-\frac{1}{2}} dx.$$

Предполагается, что $\varphi' \neq 0$ в точке поворота и в двух расположенных симметрично относительно нее точках с координатой $x = x_k$ (штрихами обозначается дифференцирование по x). Для того, чтобы было законным n -кратное дифференцирование по параметру C интеграла

$$i = \int_{x_k}^{x_{\max}} (F + C)^{-\frac{1}{2}} dx, \quad (3)$$

повышается степень стоящего в скобках выражения путем n -кратного интегрирования по частям, при использовании рекуррентной формулы

$$\int_{x_k}^{x_{\max}} (F + C)^m f dx = - \frac{(F + C)^{m+1} f}{(m + 1) F'} \Big|_{x=x_k} - \frac{1}{m + 1} \int_{x_k}^{x_{\max}} (F + C)^{m+1} \left[\frac{f}{F'} \right]' dx,$$

где $f = f(x)$ — произвольная дифференцируемая функция, не имеющая особенностей на интервале $[x_k, x_{\max}]$.

Предлагаемая методика позволяет найти связи между коэффициентами сферической и хроматической аберраций любого порядка. В данной статье записаны соотношения между коэффициентами до третьего порядка включительно, что достаточно для решения практических задач (третий порядок требуется, например, при расчете разрешающей способности масс-анализаторов с фокусировкой второго порядка по энергии и при оценке пределов применимости теории аберраций). В этом

случае для исследования отражающих систем достаточно провести трехкратное интегрирование по частям, после чего (3) записывается следующим образом:

$$i = \left[-2 \frac{(F+C)^{\frac{1}{2}}}{F'} - \frac{4}{3} \frac{F''}{(F')^3} (F+C)^{\frac{3}{2}} + \frac{8}{15} \frac{F''' F' - 3(F'')^2}{(F'')^5} (F+C)^{\frac{5}{2}} \right] \Big|_{x=x_k} + \frac{8}{15} \int_{x_k}^{x_{\max}} (F+C)^{\frac{5}{2}} \left[\frac{F''' F' - 3(F'')^2}{(F')^5} \right]' dx.$$

Условие фокусировки первого порядка по углу α_0 , полученное путем дифференцирования по параметру α_0 выражения (2), имеет вид

$$A_1 = \frac{\partial z}{\partial \alpha_0} \Big|_{\substack{\epsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0}} = \sin \theta_0 \left[-J(C, x) + 2 \cos^2 \theta_0 \frac{\partial J(C, x)}{\partial C} \right] \Big|_{C=C_0} = 0. \quad (4)$$

Через C_0 обозначено C при $\epsilon = 0$, $\alpha_0 = 0$.

Решив уравнение (4), можно найти координату $x = x_1$ гауссовой плоскости, после чего база анализатора определяется из равенства

$$b = z - z_0 = \cos \theta_0 J(C_0, x_1). \quad (5)$$

Вычислив при $x = x_1$, $\epsilon = 0$, $\alpha_0 = 0$ производные $\frac{\partial^2 z}{\partial \alpha_0^2}$ и $\frac{\partial^3 z}{\partial \alpha_0^3}$, определим коэффициенты сферической аберрации второго и третьего порядка по углу расходимости пучка в средней плоскости:

$$A_2 = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 \mathcal{Z}}{\partial \alpha_0^2} \left| \begin{array}{l} \epsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0 \end{array} \right. = \cos \theta_0 \sin^2 \theta_0 \left[-3 \frac{\partial J(C, x)}{\partial C} + \right. \\ \left. + 2 \cos^2 \theta_0 \frac{\partial^2 J(C, x)}{\partial C^2} \right] \Big|_{C=C_0}; \quad (6)$$

$$A_3 = \frac{1}{6} \frac{\partial^3 \mathcal{Z}}{\partial \alpha_0^3} \left| \begin{array}{l} \epsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0 \end{array} \right. = A_2 \left(\operatorname{ctg} \theta_0 - \frac{\operatorname{tg} \theta_0}{3} \right) + \\ + \frac{2}{3} \cos^2 \theta_0 \sin^3 \theta_0 \left[-5 \frac{\partial^2 J(C, x)}{\partial C^2} + \right. \\ \left. + 2 \cos^2 \theta_0 \frac{\partial^3 J(C, x)}{\partial C^3} \right] \Big|_{C=C_0}. \quad (7)$$

При использовании (4)–(7) можно выразить

$$J(C_0, x), \quad \frac{\partial J(C, x)}{\partial C} \Big|_{C=C_0}, \quad \frac{\partial^2 J(C, x)}{\partial C^2} \Big|_{C=C_0}, \\ \frac{\partial^3 J(C, x)}{\partial C^3} \Big|_{C=C_0} \quad (8)$$

через параметры b , A_2 , A_3 и тригонометрические функции от θ_0 . В формулы для дисперсии по энергии и для коэффициентов хроматической аберрации, как и в A_2 , A_3 , входят только выражения (8) и тригонометрические функции от θ_0 , что позволяет их выразить через те же параметры. В результате формулу для дисперсии по энергии можно записать следующим образом:

$$D_{\mathcal{Z}} = \frac{\partial \mathcal{Z}}{\partial \epsilon} \Big|_{\substack{\epsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0}} = \frac{b}{2 \cos^2 \theta_0}. \quad (9)$$

Ранее для широкого класса двухэлектродных зеркал она была получена в [1], а в общем случае для любых отражающих и преломляющих систем с двумерным электростатическим полем — в [2].

Выражения для коэффициентов хроматической аберрации приобретают более компактный вид, если в них вместо параметра b подставить $2D_z \cos^2 \theta_0$:

$$A_4 = \frac{\partial^2 z}{\partial \varepsilon \partial \alpha_0} \bigg|_{\substack{\varepsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0}} = \operatorname{tg} \theta_0 (2D_z + A_2); \quad (10)$$

$$A_5 = \frac{1}{2} \frac{\partial^2 z}{\partial \varepsilon^2} \bigg|_{\substack{\varepsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0}} = \frac{1}{4} \operatorname{tg}^2 \theta_0 [D_z (3 - \operatorname{ctg}^2 \theta_0) + A_2]; \quad (11)$$

$$A_6 = \frac{1}{2} \frac{\partial^3 z}{\partial \varepsilon \partial \alpha_0^2} \bigg|_{\substack{\varepsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0}} = D_z (3 \operatorname{tg}^2 \theta_0 + 1) + \frac{3}{2} A_2 (\operatorname{tg}^2 \theta_0 + 1) + \frac{3}{2} A_3 \operatorname{tg} \theta_0; \quad (12)$$

$$A_7 = \frac{1}{2} \frac{\partial^3 z}{\partial \varepsilon^2 \partial \alpha_0} \bigg|_{\substack{\varepsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0}} = \operatorname{tg} \theta_0 [D_z (3 \operatorname{tg}^2 \theta_0 + 1) + \frac{A_2}{4} (5 \operatorname{tg}^2 \theta_0 + 3) + \frac{3}{4} A_3 \operatorname{tg} \theta_0]; \quad (13)$$

$$A_8 = \frac{1}{6} \frac{\partial^3 z}{\partial \varepsilon^3} \bigg|_{\substack{\varepsilon = 0 \\ \alpha_0 = 0}} = \frac{D_z}{8} (5 \operatorname{tg}^4 \theta_0 - 2 \operatorname{tg}^2 \theta_0 + 1) + \frac{A_2}{4} \operatorname{tg}^4 \theta_0 + \frac{A_3}{8} \operatorname{tg}^3 \theta_0. \quad (14)$$

Из (10)–(11) видно, что при равенстве нулю коэффициента сферической аберрации A_2 отношения A_4/D_z и A_5/D_z зависят только от угла θ_0 , причем при $\theta_0 = 30^\circ$ коэффициент A_5 равен

нулю. Если A_2 и A_3 равны нулю одновременно, то значения A_6/D_z , A_7/D_z и A_8/D_z , определяемые из (12)–(14), также зависят только от угла входа θ_0 . При значениях θ_0 , которым соответствует $\text{tg } \theta_0 \gg 1$, отношения коэффициентов хроматической аберрации к дисперсии быстро растут с ростом θ_0 и для применимости теории аберраций необходимо, чтобы выполнялись условия

$$\text{stg}^2 \theta_0 \ll 1, \quad \alpha_0 \text{tg } \theta_0 \ll 1.$$

Следует отметить, что в энергоанализаторах с высоким качеством фокусировки по углу расходимости в средней плоскости большая величина хроматической аберрации может привести к уменьшению их разрешающей способности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Фшкова Т.Я. // ЖТФ. - 1987. - Т. 57. - № 7. - С. 1358–1364.
2. Карецкая С.П., Сайченко Н.Ю. // Тезисы докл. X Все-союзн. семинара по методам расчета ЭОС. — Львов, 1990. - С. 69.

Рукопись поступила 17.12.90